

Título: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM). TÉCNICAS DE ENSAYO Y DE MEDIDA. ENSAYOS DE INMUNIDAD A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS, RADIADOS Y DE RADIOFRECUENCIA		Comité / Subcomité: CT-11 / SC-4 (CODELECTRA) Consejo Superior FONDONORMA: 15/12/2010		Categoría E ICS: 33.100.20 Depósito legal: If5552011389103	
Versión:	Fecha: 2010	Páginas: 71	Gráficos/Figuras: 25	Tablas: 2	
1 OBJETO Esta Norma se aplica a la inmunidad de los equipos eléctricos y electrónicos a la energía electromagnética radiada. Define los niveles y los procedimientos de ensayo requeridos. Esta sección tiene por objeto establecer una referencia común para la evaluación de las características de funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos sometidos a campos electromagnéticos de frecuencias radioeléctricas. El método de ensayo documentado en esta Norma Técnica describe un método para valorar la inmunidad de los equipos o sistemas contra el fenómeno definido. La presente norma trata de los ensayos de inmunidad relativos a la protección contra los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de cualquier fuente.					
Normas de referencia, que al ser citadas, constituyen requisitos de esta norma: IEC 60050 (161) / IEC 61000-4-6 / IEC 61000-4-20					
Bibliografía de referencia: IEC 61000 4-3:2006 A1:2008 Compatibilidad electromagnética (CEM) Parte 4-3: Técnicas de ensayo y de medida Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia					
Tablas: Niveles de ensayo relativos a propósito general, radio teléfonos digitales, y otros dispositivos emisores de RF Requisitos para el área de campo uniforme en aplicaciones de iluminación total, iluminación parcial y el método de las ventanas independientes					
Fórmulas: Esta norma no contiene fórmulas de cálculo.					
NOTAS: 1. NVC: Norma Venezolana COVENIN. NVF: Norma Venezolana FONDONORMA. 2. Ver títulos de las normas de referencia en www.codelectra.org o en www.fondonorma.org.ve 3. Esta norma no contiene aspectos de obligatorio cumplimiento.					